



IEC 電子部品品質認証制度 (IECQ)
電子部品/組立部品/関連材料/関連工程
IECQの規則及び詳細についてはウェブサイト参照 www.iecq.org

認証書 独立試験所

IECQ 証明書番号:	IECQ-L JQAJP 13.0002-02	発行番号:	3	認証状況:	継続中
追加の認証サイト: IECQ-L JQAJP 13.0002		初回発行日: 2009/12/18			
旧認証書番号:	IECQ-L JQAJP 13.0002-03	発行日:	2017/12/24	サイト追加日	2016/01/22
CB 管理番号:	JQAQ 0002-003-T	有効期限:	2020/11/29		

沖エンジニアリング株式会社 東久留米ブランチ
〒203-0042 東京都東久留米市八幡町 1-1-1 2

当該組織、設備及びその手順は、IECQ電子部品品質認証制度において、基本規則IECQ01、施行規則IECQ03-1「全IECQスキームの一般要求事項」、IECQ03-6「独立試験所審査プログラム要求事項」、及びISO/IEC17025:2005のIECQ制度における電子部品試験に適用される項目について審査の結果、独立試験所に要求される該当項目に適合することを確認しました。

認証範囲:

添付 附属書

詳細は添付 附属書参照

発行認証機関 (CB) : Japan Quality Assurance Organization (JQA)
一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門
〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目 4 番地 4

部門長: 近藤 繁幸



JQA

後援会員団体

この認証の妥当性は、この認証書の発行認証機関による定期的なサーベイランス調査の実施によって維持されます。

注記: この認証は IECQ の施行規則に基づき、認証の停止又は取り消しとなる場合があります。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトを確認できます。

www.iecq.org





附属書

独立試験所 認証書の範囲の詳細

IECQ 認証書番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-02

CB 管理番号: JQAQ 0002-03-T

別添番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-02-S

改訂番号: 3

改訂日: 2017/12/24

ページ 1/4

試験対象部品

固定コンデンサ、固定抵抗器、ポテンショメータ、バリスタ、サーミスタ、コネクタ、リレー、スイッチ、プリント配線板、半導体デバイス、半導体集積回路、光部品

環境試験

IEC 60068-2-1:2007	低温（耐寒性）試験
IEC 60068-2-2:2007	高温（耐熱性）試験
IEC 60068-2-11:1981	塩水噴霧試験
IEC 60068-2-13:1983	減圧試験
IEC 60068-2-14:2009	温度変化試験
IEC 60068-2-18:2000	耐水性試験及び指針
IEC 60068-2-20:2008	端子付部品のはんだ付け性試験及びはんだ耐熱性試験
IEC 60068-2-30:2005	温湿度サイクル試験 (12+12 時間サイクル)
IEC 60068-2-38:2009	温湿度組合せ（サイクル）試験
IEC 60068-2-40:1976	低温・減圧複合試験
IEC 60068-2-41:1976	高温・減圧複合試験
JIS C 60068-2-42:1993	接点及び接続部の二酸化硫黄試験
JIS C 60068-2-43:1993	接点及び接続部の硫化水素試験
IEC 60068-2-52:1996	塩水噴霧（サイクル）試験
IEC 60068-2-54:2006	はんだ付け性試験（平衡法）
IEC 60068-2-58:2015	SMDのはんだ付け性試験
IEC 60068-2-60:1995	混合ガス流腐食試験
IEC 60068-2-66:1994	高温高湿、定常（不飽和加圧水蒸気）試験
IEC 60068-2-69:2007	表面実装部品（SMD）のはんだ付け性試験方法（平衡法）
IEC 60068-2-78:2012	高温高湿（定常）試験方法

この附属書は、認証書と使用したときのみ有効です。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQの公式ウェブサイトを確認できます。 www.iecq.org

一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門 (JQA)

〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目4番地4





附属書

独立試験所 認証書の範囲の詳細

IECQ 認証書番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-02

CB 管理番号: JQAQ 0002-03-T

別添番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-02-S

改訂番号: 3

改訂日: 2017/12/24

ページ 2/4

IEC 60068-2-83:2011	ソルダペーストを用いた平衡法による 表面実装部品 (SMD) のはんだ付け性試験方法
EIAJ ET-7404:1997	ソルダペーストを用いた表面実装部品の はんだ付け性試験方法 (平衡法)
JIS D 0205:1987	自動車部品及び耐候性試験方法
MIL STD 202G	電子・電気部品試験方法
MIL STD 883K	マイクロサーキット試験方法

機械的試験

IEC 60068-2-6:2007	正弦波振動試験
IEC 60068-2-7:1983	加速度 (定常) 試験
IEC 60068-2-27:2008	衝撃試験
IEC 60068-2-31:2008	落下試験及び転倒試験
IEC 60068-2-64:2008	広帯域ランダム試験
JIS C 60068-2-75:2004	ハンマ試験

耐火性試験

IEC 60695-2-10:2013	グローワイヤ試験装置及び一般試験方法
IEC 60695-2-11:2014	最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法
IEC 60695-2-12:2010	材料に対するグローワイヤ燃焼性指数 (GWF I)
IEC 60695-2-13:2010	材料に対するグローワイヤ着火温度指数 (GWIT)
IEC 60695-11-5:2004	ニードルフレーム (注射針バーナー) 試験方法

この附属書は、認証書と使用したときのみ有効です。
この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。
この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。
この認証の認証状況及びその真偽については、IECQの公式ウェブサイトを確認できます。 www.iecq.org

一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門 (JQA)

〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目4番地4



附属書

独立試験所 認証書の範囲の詳細

IECQ 認証書番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-02

CB 管理番号: JQAQ 0002-03-T

別添番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-02-S

改訂番号: 3

改訂日: 2017/12/24

ページ 3/4

測定範囲

受動部品

品種/部品名	測定可能な特性値: 測定範囲
固定抵抗器	(1) 抵抗値 : 1Ω~100MΩ (2) 抵抗温度特性及び抵抗値のずれ : 温度範囲 -55℃~+150℃ (測定可能温度範囲) (3) 電圧係数 : ±0.02%/V (4) 絶縁抵抗 : 5×10 ⁵ Ω~2×10 ¹⁴ Ω (5) 耐電圧 : AC、DC 0~5KV
可変抵抗器	(1) 抵抗値 : 1Ω~120MΩ (2) 抵抗温度特性及び抵抗値のずれ : 温度範囲 -40℃~+150℃ (測定可能温度範囲) (3) 絶縁抵抗 : 5×10 ⁵ Ω~10 ¹⁴ Ω (4) 耐電圧 : AC、DC 0~5KV (5) 集中接触抵抗 : 1mΩ
バリスタ	バリスタ電圧 : 1500V (1mA以下)

機構部品

品種/部品名	測定可能な特性値: 測定範囲
コネクタ (電子機器用) [プリント配線板用コネクタ] [高周波用コネクタ] [低周波角形コネクタ]	(1) 絶縁抵抗 : 5×10 ⁵ Ω~2×10 ¹⁴ Ω (2) 耐電圧 : AC、DC 0~5KV (3) 低電圧・低電流下の接触抵抗 : 1mΩ~100Ω (4) コントクトのチャタリング* : 1μsec以上
リレー (制御用小形)	(1) 耐電圧 : AC、DC 0~5KV (2) 絶縁抵抗 : 5×10 ⁵ Ω~2×10 ¹⁴ Ω (3) コイルの直流抵抗 : 1Ω~10KΩ (4) 接触抵抗 : 1mΩ~100Ω (5) 動作電圧 : 1V以上 (6) 復帰電圧 : 1V以上 (7) 動作時間 : 1msec以上 (8) 復帰時間 : 1msec以上 (9) 接点のバウンス : 1μsec以上 (10) 接点のチャタリング* : 1μsec以上
スイッチ (電子機器用)	(1) 接触抵抗 : 1mΩ~100Ω (2) 絶縁抵抗 : 5×10 ⁵ Ω~2×10 ¹⁴ Ω (3) 耐電圧 : AC、DC 0~5KV (4) 接触抵抗の変動 : 1mΩ以上

この附属書は、認証書と使用したときのみ有効です。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQの公式ウェブサイトを確認できます。 www.iecq.org



一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門 (JQA)

〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目4番地4



附属書

独立試験所 認証書の範囲の詳細

IECQ 認証書番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-02

CB 管理番号: JQAQ 0002-03-T

別添番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-02-S

改訂番号: 3

改訂日: 2017/12/24

ページ 4/4

測定範囲

プリント配線板

品種/部品名	測定可能な特性値: 測定範囲
プリント配線板	(1) 導体及びスルーホール部のメッキ部の抵抗 : 1 mΩ~1000Ω (2) 耐電圧 : AC、DC 0~5 KV (3) 絶縁抵抗 : 5 × 10 ⁵ Ω~10 ¹⁴ Ω

この附属書は、認証書と使用したときのみ有効です。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQの公式ウェブサイトを確認できます。 www.iecq.org

一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門 (JQA)

〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目4番地4

